

Test Probe GKS-100 302 090 A 1000

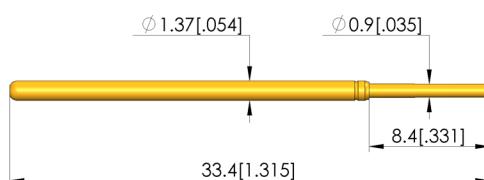
Article GKS-100-1132



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology

- Pointes de test confirmées à des millions d'exemplaires, pour mettre les cartes électroniques en contact
- Pour un contact optimal au niveau des points de test (p. ex. PAD, VIA et PIN), différentes formes de têtes sont disponibles au choix en différents diamètres et finitions.
- Différentes forces de ressort disponibles, ainsi que des variantes avec ressort en acier inoxydable pour les hautes températures
- Pour régler les conditions de course optimales dans l'adaptateur de contrôle, il est possible de réaliser différentes hauteurs d'incorporation en combinant la tige de contact et la douille de contact



Données générales

Groupe de produits: ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)
Sous-groupe de produits: Course standard GKS
Série: GKS-100
Trame: 2,54 mm
Mise en contact de: Grande broche
Magnétique: oui
Type d'incorporation: enfichable
Système de changement rapide: oui
Hauteur d'incorporation réglable: non
Sécurisé antitorsion: non
Douille de contact adaptée: KS-100
Température min.: -40 °C
Température max.: 80 °C
Conforme RoHS: oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête: 02 Plat
Diamètre de tête: 0,9 mm
Forme de tête surface: A Or
Forme de tête matériau: 3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale: 5 A
Résistance (R₁) typique: 20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale: 33,4 mm
Diamètre de douille de pointe: 1,37 mm
Course maximale: 6,35 mm
Précontrainte ressort: 0,35 N
Cote E / Cote de collet: 00
Force de ressort en course de travail: 1 N
Course de travail recommandée: 4,3 mm

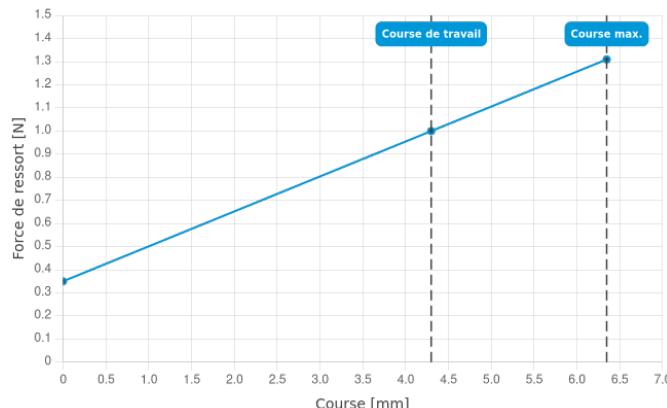
Test Probe GKS-100 302 090 A 1000

Article GKS-100-1132



DIRECTEMENT AU PRODUIT

ingun[®]
Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Tarifs et délais de livraison sur demande.
Modifications techniques réservées. 11/25_FR

Informations avancées sur le thème
Pointes de test ICT/FCT

